

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 4 区分
 【発行日】平成 17 年 9 月 29 日 (2005.9.29)

【公開番号】特開 2003-7089 (P2003-7089A)
 【公開日】平成 15 年 1 月 10 日 (2003.1.10)
 【出願番号】特願 2002-121654 (P2002-121654)
 【国際特許分類第 7 版】

G 1 1 C 29/00
 G 0 1 R 31/28
 G 0 1 R 31/317

【F I】

G 1 1 C 29/00 6 5 1 Z
 G 0 1 R 31/28 B
 G 0 1 R 31/28 A

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 4 月 21 日 (2005.4.21)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

被試験デバイス (D U T) の試験に関連するパラメータ値を保存するための方法であって、

(a) 第 1 の段数を有する刺激パイプラインを通じて前記 D U T へと送信すべき刺激信号値を発生させるテストプログラムをプログラム実行環境において実行するステップと、

(b) 前記送信された刺激信号値で前記 D U T を動作させることにより得られた応答信号値を、前記 D U T から前記プログラム実行環境へと、第 2 の段数を有する応答パイプラインを介して送るステップと、

(c) 前記テストプログラムの実行サイクル毎に前記刺激パイプライン又は応答パイプラインの一方における選択位置から履歴 F I F O へと、回復されるべきパラメータ値を記憶するステップと、

(d) 選択されたエラー条件に応答して、前記 D U T を含む前記応答パイプライン内においてエラー信号を生成するステップと、

(e) 前記ステップ (c) における記憶処理と、前記ステップ (d) におけるエラー信号の関連インスタンスの生成との間を隔てるパイプライン段数に対応するように、前記履歴 F I F O の深さを調整するステップと、

(f) 前記ステップ (d) にて生成されたエラー信号に応答して、前記ステップ (e) にて調整された深さに記憶された前記パラメータ値を前記履歴 F I F O 中で保存するステップと、

を含む方法。

【請求項 2】

(g) 前記ステップ (f) の後に、前記履歴 F I F O 中に保存されている前記パラメータ値を取得するステップをさらに含む、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

前記ステップ (a) が、バッファメモリアドレスの生成を含み、更に前記ステップ (c) 、 (f) 及び (g) における前記パラメータが、バッファメモリアドレスであることを

特徴とする、請求項 2 に記載の方法。

【請求項 4】

前記ステップ (c)、(f) 及び (g) における前記パラメータが、エラーとなった応答信号値であることを特徴とする、請求項 2 に記載の方法。